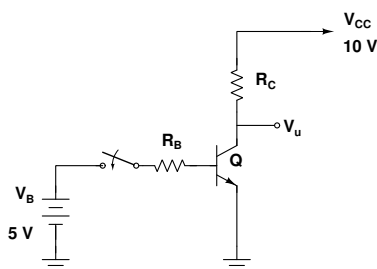


## PROVA SCRITTA di DISPOSITIVI ELETTRONICI del 8 Settembre 2016

### ESERCIZIO 1

Il transistoro in figura è un  $n^+pn^+$ , con  $W = 3 \mu\text{m}$ ,  $N_{Abase} = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ,  $\mu_n = 0.1 \text{ m}^2/\text{Vs}$ ,  $\tau_n = 10^{-6} \text{ s}$ ,  $S = 1 \text{ mm}^2$ . Trascurare le regioni di svuotamento delle giunzioni polarizzate in diretta. Il tasto comanda l'accensione (transistore in saturazione) e lo spengimento del transistoro.



- 1) A tasto chiuso, la corrente di collettore deve essere pari a 10 mA: stimare  $R_C$ . Determinare la corrente di base affinché, nel transistoro di spengimento, si abbia uno storage delay time ( $t_{SD}$ ) minore di  $1 \mu\text{s}$ : stimare  $R_B$ . [4]
- 2) Determinare il profilo di portatori minoritari in base a regime (a transistoro acceso), e determinare le tensioni ai terminali, assumendo il valore approssimato di  $I_C = 10 \text{ mA}$ . Determinare il valore esatto di  $V_{CE}$ . [3]
- 3) In fase di accensione, determinare il tempo che la corrente di collettore impiega per andare a regime. [3]

### ESERCIZIO 2

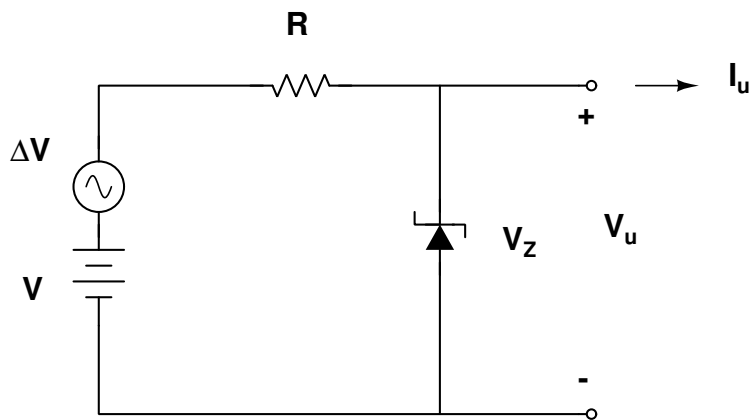
Un condensatore  $n\text{MOS}$  ha  $N_A = 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ ,  $t_{ox} = 20 \text{ nm}$ , funzione di lavoro del gate uguale a quella del silicio. All'interfaccia ossido-silicio (in uno strato molto sottile nell'ossido) è presente una carica negativa, dovuta ad una concentrazione superficiale di accettori pari a  $10^{12} \text{ cm}^{-2}$  ( $Q = -q10^{12} \text{ C/cm}^2$ ). Sul gate viene imposto un gradino di tensione pari a 5 V ( $V_{GBulk} = 0$  per  $t < 0$ ,  $V_{GBulk} = 5 \text{ V}$  per  $t > 0$ ).

- 1) Determinare l'ampiezza della regione di svuotamento sotto il gate per  $t = 0^+$  e per  $t \rightarrow \infty$ . [4]

- 2) Determinare il campo elettrico nel silicio, all'interfaccia ossido-silicio, a  $t = 0^+$  e a  $t \rightarrow \infty$  (attenzione! La carica parassita si trova nell'ossido). [3]  
 3) Determinare il campo elettrico nell'ossido a  $t = 0^+$  e a  $t \rightarrow \infty$ . [3]

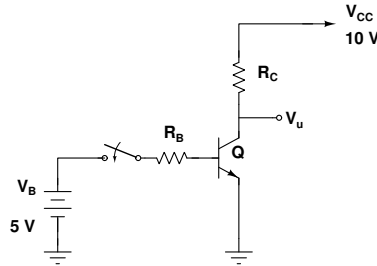
### ESERCIZIO 3

Nel circuito in figura, una sorgente di tensione non stabilizzata viene usata per generare una tensione pari a 5 V stabilizzata. La sorgente di tensione è schematizzabile con un generatore di tensione in continua  $V = 9$  V, più un generatore sinusoidale  $\Delta V = V_P \cos(\omega t)$ , con  $V_P = 1$  V. Il diodo zener è costituito da una giunzione  $p + n$ , ed il campo elettrico di break-down è pari a 50 MV/m.



- 1) Determinare il drogaggio della parte  $n$ , in maniera tale da avere  $V_Z = 5$  V (trascurare  $V_0$ ). [3]  
 2) Determinare la resistenza  $R$  in maniera tale che il generatore possa funzionare con un carico massimo, posto ai morsetti di uscita (non indicato), pari a  $10 \Omega$  (resistenza minima). [4]  
 3) Il diodo zener ha una resistenza differenziale pari a  $1 \Omega$ . Determinare il valore massimo del fattore di regolazione in uscita  $\frac{\Delta V_u}{\Delta V}$ . [3]

**ESERCIZIO 1** Il transistoro in figura è un  $n^+pn^+$ , con  $W = 3 \mu\text{m}$ ,  $N_{Abase} = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ,  $\mu_n = 0.1 \text{ m}^2/\text{Vs}$ ,  $\tau_n = 10^{-6} \text{ s}$ ,  $S = 1 \text{ mm}^2$ . Trascurare le regioni di svuotamento delle giunzioni polarizzate in diretta. Il tasto comanda l'accensione (transistore in saturazione) e lo spengimento del transistoro.



1) A tasto chiuso, la corrente di collettore deve essere pari a 10 mA: stimare  $R_C$ . Determinare la corrente di base affinché, nel transitorio di spengimento, si abbia uno storage delay time ( $t_{SD}$ ) minore di  $1 \mu\text{s}$ : e stimare  $R_B$ . [4]

2) Determinare il profilo di portatori minoritari in base a regime (a transistoro acceso), e determinare le tensioni ai terminali, assumendo il valore approssimato di  $I_C = 10 \text{ mA}$ . Determinare il valore esatto di  $V_{CE}$ . [3]

3) In fase di accensione, determinare il tempo che la corrente di collettore impiega per andare a regime. [3]

## SOLUZIONE 1

1) Per  $V_{CE}$  piccole ( $< V_{BE}$ ) il transistoro è in saturazione, e quindi avremo che  $I_C \simeq \frac{V_{CC}}{R_C} \rightarrow R_C = 1 \text{ k}\Omega$ . Consideriamo una situazione a regime, con il tasto chiuso, e calcoliamo il tempo che impiega il transistoro ad uscire dalla saturazione, che per definizione è  $t_{SD}$ . La carica in base si evolve come:

$$\begin{aligned} Q_B(t) &= Q_B(t = 0^-) e^{-\frac{t}{\tau_n}} \\ Q_B(t = 0^-) &= I_B \tau_n \end{aligned}$$

Per  $t > 0$  e  $t < t_{SD}$  avremo che la corrente di collettore rimane praticamente costante, e pari ad approssimativamente  $I_C = \frac{V_{CC}}{R_C}$ . Il tempo  $t_{SD}$  è tale che

la carica in base raggiunge la condizione di soglia della saturazione:

$$I_C = \frac{Q_B(t_{SD})}{\tau_t} \quad (1)$$

Avremo dunque per  $t_{SD}$ :

$$\begin{aligned} I_C &= I_B \frac{\tau_n}{\tau_t} e^{-\frac{t_{SD}}{\tau_n}} \\ \beta_F &= \frac{\tau_n}{\tau_t} \\ t_{SD} &= \tau_n \ln \left( \frac{I_B \beta_F}{I_C} \right) \end{aligned}$$

o anche, per il progetto della  $I_B$  dato  $t_{SD}$ :

$$I_B = \frac{I_C}{\beta_F} e^{\frac{t_{SD}}{\tau_n}} \quad (2)$$

Calcoliamo  $\beta_F$  in saturazione, assumendo trascurabili le ampiezze delle regioni di svuotamento. In realtà, dovremo calcolare  $\beta_F$  con  $V_{CB} = 0$ , cioè al limite della saturazione (con  $W_{CB} = W_{CB}(V_0 \text{ } CB)$ ). Semplificando i conti ( $SW = 3 \text{ } \mu\text{m}$ ):

$$\begin{aligned} D_n &= \frac{kT}{q} \mu_n = 2.59 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{Vs} \\ \tau_t &= \frac{W^2}{2D_n} \\ \beta_F &= \frac{\tau_n}{\tau_t} = \frac{\tau_n 2D_n}{W^2} = 575 \\ I_B &= \frac{I_C}{\beta_F} e^1 = 47 \text{ } \mu\text{A} \end{aligned} \quad (4)$$

La corrente di base viene fornita tramite un generatore di tensione  $V_B = 5 \text{ V}$  ed una resistenza, il cui valore stimato considerando  $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$  è:

$$\begin{aligned} I_B &= \frac{V_B - V_\gamma}{R_B} \\ R_B &= \frac{V_B - V_\gamma}{I_B} = 90 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

2) Avremo che il profilo in base è trapezoidale, e possiamo scrivere:

$$I_C = qSD_n \frac{d\delta n}{dx} = qSD_n \frac{\delta n(0) - \delta n(W)}{W}$$

$$I_B = \frac{qS}{\tau_n} \frac{\delta n(0) + \delta n(W)}{2} W$$

Risolvendo il sistema avremo:

$$\delta n(0) = 1.35 \times 10^{20} \text{ m}^{-3}$$

$$\delta n(W) = 6.08 \times 10^{19} \text{ m}^{-3}$$

Da notare che è verificata la bassa iniezione. Dagli eccessi in 0 e  $W$  possiamo risalire alle tensioni  $V_{BE}$  e  $V_{CE}$ :

$$\delta n(0) = \frac{n_i^2}{N_A} \left( e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \simeq \frac{n_i^2}{N_A} e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}$$

$$V_{BE} = V_T \ln \left( \frac{\delta n(0) N_A}{n_i^2} \right) = 0.58 \text{ V}$$

$$\delta n(W) \simeq \frac{n_i^2}{N_A} e^{\frac{V_{BC}}{V_T}}$$

$$V_{BC} = V_T \ln \left( \frac{\delta n(W) N_A}{n_i^2} \right) = 0.56 \text{ V}$$

Quindi la  $V_{CE}$  risulta effettivamente molto piccola, pari a 0.02 V.

3) Nel transitorio di accensione abbiamo:

$$Q(t) = I_B \tau_n \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right) \quad (5)$$

La corrente  $I_C$  assume il valore di regime quando il transistor arriva al limite della zona attiva diretta:

$$Q(t_{ON}) = I_{Cmax} \tau_n$$

$$I_B \tau_n \left( 1 - e^{-\frac{t_{ON}}{\tau_n}} \right) = I_{Cmax} \tau_n$$

$$\left( 1 - e^{-\frac{t_{ON}}{\tau_n}} \right) = \frac{I_C}{I_B \beta_F}$$

$$t_{ON} = \tau_n \ln \frac{1}{1 - \frac{I_C}{I_B \beta_F}} = 0.47 \text{ } \mu\text{s}$$

## ESERCIZIO 2

Un condensatore  $n$ MOS ha  $N_A = 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ ,  $t_{ox} = 20 \text{ nm}$ , funzione di lavoro del gate uguale a quella del silicio. All'interfaccia ossido-silicio (in uno strato molto sottile nell'ossido) è presente una carica negativa, dovuta ad una concentrazione superficiale di accettori pari a  $10^{12} \text{ cm}^{-2}$  ( $Q = -q10^{12}$ ). Sul gate viene imposto un gradino di tensione pari a  $5 \text{ V}$  ( $V_{GBulk} = 0$  per  $t < 0$ ,  $V_{GBulk} = 5 \text{ V}$  per  $t > 0$ ).

1) Determinare l'ampiezza della regione di svuotamento sotto il gate per  $t = 0^+$  e per  $t \rightarrow \infty$ . [4]

2) Determinare il campo elettrico nel silicio, all'interfaccia ossido-silicio, a  $t = 0^+$  e a  $t \rightarrow \infty$  (attenzione! La carica parassita si trova nell'ossido). [3]

3) Determinare il campo elettrico nell'ossido a  $t = 0^+$  e a  $t \rightarrow \infty$ . [3]

## SOLUZIONE 2

1) Calcoliamo la tensione di soglia a temperatura ambiente.

$$\begin{aligned} Q &= -1.602 \times 10^{-3} \text{ C/m}^2 \\ \psi_B &= \frac{kT}{q} \ln \left( \frac{N_A}{n_i} \right) = 0.329 \text{ V} \\ C_{ox} &= \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}} = 1.726 \times 10^{-3} \text{ F/m}^2 \\ V_{TH} &= \frac{\sqrt{2\epsilon_s q N_A 2\psi_B}}{C_{ox}} + 2\psi_B - \frac{Q}{C_{ox}} = 1.86 \text{ V} \end{aligned}$$

A  $t = 0^+$  la carica mobile è nulla, poichè non si è ancora generata termicamente. Quindi possiamo scrivere l'equazione:

$$\begin{aligned} V_{GS} &= -\frac{Q}{C_{ox}} - \frac{Q_W}{C_{ox}} + V_S \\ V_{GS} &= \frac{\sqrt{2\epsilon_s q N_A V_S}}{C_{ox}} + V_S - \frac{Q}{C_{ox}} \end{aligned}$$

Risolviendo questa equazione, otteniamo come valore accettabile di  $V_S = 3.62 \text{ V}$ . Da ciò otteniamo:

$$W(0^+) = \sqrt{\frac{2\epsilon_s}{qN_A} V_S} = 0.97 \text{ } \mu\text{m} \quad (6)$$

Per tempi molto lunghi la regione di svuotamento sotto il gate è quella dovuta a  $2\psi_B$ :

$$W(t \rightarrow \infty) = \sqrt{\frac{2\epsilon_s}{qN_A}} 2\psi_B = 0.33 \text{ } \mu\text{m} \quad (7)$$

2) Possiamo applicare il teorema di Gauss per calcolare il campo elettrico nel silicio, all'interfaccia:

$$\mathcal{E}_{Si}(x=0) = -\frac{Q_{Si}}{\epsilon_{Si}} = -\frac{Q_n + Q_W}{\epsilon_{Si}} \quad (8)$$

A  $t = 0^+$  la carica mobile è 0, e quindi:

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{Si}(t=0^+) &= -\frac{Q_W(V_S)}{\epsilon_{Si}} \\ \mathcal{E}_{Si}(t=0^+) &= \frac{\sqrt{2\epsilon_s q N_A V_S}}{\epsilon_{Si}} = 7.42 \text{ MV/m} \end{aligned}$$

Per  $t \rightarrow \infty$  la carica fissa è quella dovuta a  $2\psi_B$ , mentre quella mobile (negativa) si può calcolare come  $Q_n = C_{ox}(V_{GS} - V_{TH}) = 5.41 \times 10^{-3} \text{ C/m}^2$ . Quindi:

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{Si}(t \rightarrow \infty) &= -\frac{Q_n + Q_W(2\psi_B)}{\epsilon_{Si}} \\ \mathcal{E}_{Si}(t \rightarrow \infty) &= \frac{C_{ox}(V_{GS} - V_{TH}) + \sqrt{2\epsilon_s q N_A V_S}}{\epsilon_{Si}} = 54.6 \text{ MV/m} \end{aligned}$$

3) Il campo elettrico nell'ossido è diverso da quello del silicio. Questo è dovuto sia alle diverse costanti dielettriche, sia alla carica all'interfaccia  $Q$ . Applicando di nuovo il teorema di Gauss nell'ossido avremo:  $t = 0^+$ :

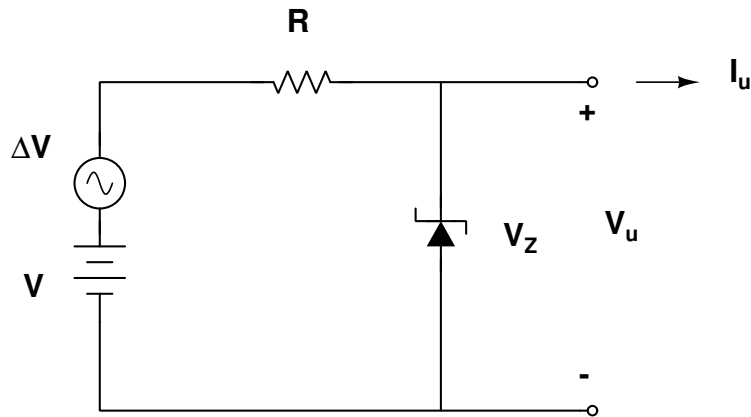
$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{ox}(t=0^+) &= -\frac{Q + Q_W(V_S)}{\epsilon_{ox}} \\ \mathcal{E}_{ox}(t=0^+) &= \frac{-Q + \sqrt{2\epsilon_s q N_A V_S}}{\epsilon_{ox}} = 69.03 \text{ MV/m} \end{aligned}$$

$t \rightarrow \infty$ :

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{ox}(t \rightarrow \infty) &= -\frac{Q + Q_n + Q_W(2\psi_B)}{\epsilon_{Si}} \\ \mathcal{E}_{ox}(t \rightarrow \infty) &= \frac{-Q + C_{ox}(V_{GS} - V_{TH}) + \sqrt{2\epsilon_s q N_A V_S}}{\epsilon_{Si}} = 213 \text{ MV/m} \end{aligned}$$

### ESERCIZIO 3

Nel circuito in figura, una sorgente di tensione non stabilizzata viene usata per generare una tensione pari a 5 V stabilizzata. La sorgente di tensione è schematizzabile con un generatore di tensione in continua  $V = 9$  V, più un generatore sinusoidale  $\Delta V = V_P \cos(\omega t)$ , con  $V_P = 1$  V. Il diodo zener è costituito da una giunzione  $p+n$ , ed il campo elettrico di break-down è pari a 50 MV/m.



- 1) Determinare il drogaggio della parte  $n$ , in maniera tale da avere  $V_Z = 5$  V (trascurare  $V_0$ ). [3]
- 2) Determinare la resistenza  $R$  in maniera tale che il generatore possa funzionare con un carico massimo, posto ai morsetti di uscita (non indicato), pari a  $10 \Omega$  (resistenza minima). [4]
- 3) Il diodo zener ha una resistenza differenziale pari a  $1 \Omega$ . Determinare il valore massimo del fattore di regolazione in uscita  $\frac{\Delta V_u}{\Delta V}$ . [3]

### SOLUZIONE 3

- 1) Quando il campo elettrico massimo nella giunzione raggiunge quello critico, la giunzione va in break-down. Avremo:

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{max} &= \frac{qN_D}{\epsilon_s} x_n = \frac{qN_D}{\epsilon_s} W \\ \mathcal{E}_{max} &= \frac{\sqrt{2\epsilon_s q N_D (V_0 + V_{BD})}}{\epsilon_s} \simeq \frac{\sqrt{2\epsilon_s q N_D V_{BD}}}{\epsilon_s}\end{aligned}$$



Da questa ultima equazione possiamo ricavarci  $N_D = 1.6 \times 10^{23} \text{ m}^{-3}$ , dato  $V_{BD} = V_Z = 5 \text{ V}$  e  $\mathcal{E}_{max} = 50 \text{ MV/m}$

2) La corrente massima che il generatore deve erogare è dunque  $5/10=0.5$  A (600 mA). Quando il generatore ha il massimo carico (massima corrente, minima resistenza), tutta la corrente passa dal carico. Quando il generatore non è caricato, questa corrente polarizza il diodo zener. Una stima della resistenza  $R$  si può ottenere come:

$$I_{max} = \frac{V_{min} - V_u}{R}$$
$$R = \frac{V_{min} - V_u}{I_{max}} = \frac{8 - 6}{0.6} = 6 \ \Omega$$

3) La massima variazione della tensione di uscita, per una variazione della tensione di ingresso, è data da:

$$\Delta V_u = \Delta V \frac{R_{out}}{R + R_{out}} \quad (9)$$

dove  $R_{out}$  è data dal parallelo tra la resistenza  $R_Z$  dello zener e la resistenza di carico all'uscita. Quindi la massima variazione in uscita si ha con il minimo carico, cioè senza resistenza in uscita:  $R_{out} = R_Z$ ,  $R_{load} \rightarrow \infty$ :

$$\Delta V_u = 1 \frac{R_Z}{R + R_Z} = 0.14 \text{ V} \quad (10)$$